

阪和電子工業(株) 2009 年台灣 靜電放電研討座談會

HANWA

2009 TAIWAN ELECTRO STATIC DISCHARGE

SEMINAR

弊社日本阪和電子工業(株)近年在台灣承蒙ESD業界及學界的多方提携與指教，不論在公司運營上及技術提昇上皆有重大展獲，感激不盡。由弊社社長發起的海外研討座談會，去年首屆舉辦，得到產學界的熱烈回響與參與，為希望能再度與台灣產學界作更進一步、更直接的交流，今年也將舉辦2009年第2屆的海外研討座談會，期待大家的共襄盛舉。

◆時間：2009 年 7 月 23 日 星期四 下午 13:30~17:30

◆地點：新竹國賓飯店 10 樓聯誼廳 (新竹市中華路 2 段 188 号)

◆議程：

1:30~1:35 OPEN

1:35~1:45 岩谷 (代理商) 木村總經理 致詞

1:45~2:30 HANWA/長谷川 課長

*主講：HANWA 最近國際活動、台灣銷售成績、JEITA、HMM

2:30~2:45 休息

2:45~3:45 HIMAX 陳東陽 博士

*主講：Wafer ESD Tester Verification and Evaluation

3:45~4:00 問答。

4:00~4:15 休憩

4:15~5:15 台灣交通大學/IEEE Fellow 柯明道教授

*主講：電路板層級元件充電模式之靜電放電測試方法

(Suggestion for Board-Level CDM ESD Test)

5:15~5:30 問與答

5:30 ENDING

◆誠摯歡迎蒞臨指導。

◆連絡人：台灣岩谷 (股) 曾元宏 0912-584-685

以上

電路板層級元件充電模式之 靜電放電測試方法

Suggestion for Board-Level CDM ESD Test

柯明道教授 (Prof. Ming-Dou Ker), *IEEE FELLOW*

(1) Dept. of Electronic Engineering, I-Shou University,
Kaohsiung, Taiwan. (義守大學)

(2) Institute of Electronics, National Chiao-Tung University,
Hsinchu, Taiwan. (交通大學)

mdker@ieee.org

July 23, 2009

1

Ker'09

積體電路產品之靜電放電(ESD)耐受規格

Chip-Level ESD:

	HBM	MM	CDM
Okay	+/- 2kV	+/- 200V	+/- 1kV
Safe	+/- 4kV	+/- 400V	+/- 1.5kV
Super	+/- 10kV	+/- 1kV	+/- 2kV

← Typical Spec.

System-Level ESD: (IEC 61000-4-2)

Level	Contact Discharge	Air Discharge
1	+/- 2 kV	+/- 2 kV
2	+/- 4 kV	+/- 4 kV
3	+/- 6 kV	+/- 8 kV
4	+/- 8 kV	+/- 15 kV



2

Ker'09